

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

551 741

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. Oktober 2004 (14.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/088289 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01N 21/31,
G05B 15/00

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LUDWIG, Michael
[DE/DE]; Rhode-Island-Allee 27, 76149 Karlsruhe (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/003473

(22) Internationales Anmeldedatum:
1. April 2004 (01.04.2004)

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

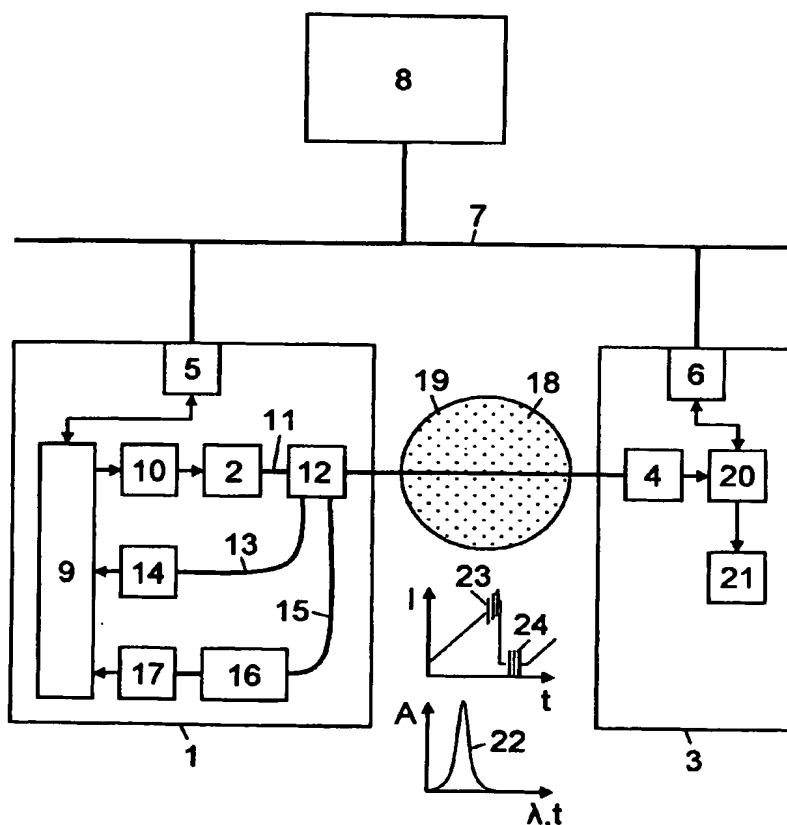
(30) Angaben zur Priorität:
103 14 793.4 1. April 2003 (01.04.2003) DE

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: PROCESS ABSORPTION SPECTROMETER

(54) Bezeichnung: PROZESS-ABSORPTIONSSPEKTROMETER



(57) Abstract: The aim of the invention is to reduce the apparatus-related complexity and the mounting effort in a process absorption spectrometer taking in situ measurements. Said aim is achieved by providing the process absorption spectrometer with a unit (1) comprising a source of radiation (2) and at least one additional unit (3) encompassing a detector (4), both units (1, 3) being embodied as pieces of field equipment and being connected to a field bus (7).

(57) Zusammenfassung: Um den geräte- und montagetechnischen Aufwand bei einem insitu messenden Prozess-Absorptionsspektrometer zu verringern, weist dieses eine Strahlungsquelle (2) enthaltende Einheit (1) und mindestens einen Detektor (4) enthaltende weitere Einheit (3) auf, wobei beide Einheiten (1, 3) als Feldgeräte ausgebildet und an einem Feldbus (7) angeschlossen sind.

WO 2004/088289 A1



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

Prozess-Absorptionsspektrometer

- 5 Das Prinzip der Absorptionsspektroskopie beruht auf der selektiven Absorption von Strahlung einer bestimmten Wellenlänge durch bestimmte Gase (Gasmoleküle), insbesondere im nahen Infrarotbereich (NIR). Die Strahlungsabsorption führt zur Entstehung eines für das jeweilige Gas charakteristischen
- 10 Spektrums. Wenn es gelingt, ein Spektrometer selektiv auf das Spektrum einzustellen, das einen bestimmten Gas zuzuordnen ist, so ist das erhaltene Messsignal von der Anzahl der Moleküle, die sich in einem Messvolumen (Messzelle) zwischen einer Strahlungsquelle und einem Detektor des Spektrometers
- 15 befinden, proportional. Für die industrielle Gasanalyse bekannte Verfahren sind beispielsweise die nicht-dispersive Infrarot (NDIR)-Spektroskopie, die Fouriertransform-Infrarot (FTIR)-Spektroskopie und die Diodenlaser-Spektroskopie.
- 20 Bei der so genannten In-line-Messung oder In-situ-Messung ist die Messzelle des Spektrometers entweder direkt in dem Messgasstrom eingebaut oder die das Messgas führende Leitung, z. B. ein Rohr oder ein Kamin, dient selbst als Messzelle. Die Strahlungsquelle und der Detektor, oder bei mehrkanaliger
- 25 Messung mehrere Detektoren, sind daher an unterschiedlichen Stellen der Prozessanlage angeordnet, wozu das Spektrometer in zwei oder mehr Teilgeräte unterteilt ist. Diese Teilgeräte sind über spezielle Koppelleitungen miteinander verbunden, damit sie als Gesamtgerät funktionieren können. Die Koppel-
- 30 leitungen und die über sie laufenden Signale sind dabei technologie- bzw. gerätespezifisch ausgelegt (z. B. Hybridkabel mit elektrischen Leitungen und Glasfaserleitungen). Das Vorsehen und Verlegen solcher Spezialleitungen ist mit einem entsprechenden Aufwand verbunden.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, den geräte- und montagetechnischen Aufwand bei In-situ-Absorptionsspektrometern zu verringern.

- 5 Gemäß der Erfindung wird die Aufgabe gelöst durch ein Prozess-Absorptionsspektrometer mit einer eine Strahlungsquelle enthaltenden Einheit und mindestens einer einen Detektor enthaltenden weiteren Einheit, wobei beide Einheiten als Feldgeräte ausgebildet und an einem Feldbus angeschlossen sind.
- 10 Da die Einheiten des erfindungsgemäßen Spektrometers als Feldgeräte ausgebildet sind, können sie wie jedes andere Feldgerät ohne jeden Zusatzaufwand in einer Prozessanlage bzw. einem Prozessautomatisierungssystem installiert, parametrisiert und betrieben werden. Insbesondere die Verkabelung
- 15 erfolgt standardmäßig wie bei anderen Feldgeräten.

- Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Spektrometers enthält die den Detektor enthaltende weitere Einheit Mittel zur Erzeugung eines Messergebnisses aus Messsignalen des Detektors und weiteren Signalen,
- 20 die von der die Strahlungsquelle enthaltenden Einheit an die den Detektor enthaltende weitere Einheit übertragen werden. Bei den weiteren Signalen kann es sich beispielsweise um Referenzsignale handeln, die in der die Strahlungsquelle enthaltenden Einheit durch Referenzmessung an einem Referenzgas
- 25 gewonnen werden und für die Erzeugung des Messergebnisses notwendig sind.

- Diese Referenzsignale können in vorteilhafter Weise von der
- 30 die Strahlungsquelle enthaltenden Einheit über den Feldbus an die den Detektor enthaltende weitere Einheit übertragen werden. Dies kann beispielsweise durch eine so genannte Slave-Slave-Kommunikation erfolgen. Hierbei handelt es sich um eine Funktion bei dem Feldbus "Profibus", die auch als Datenverkehr bezeichnet wird. Die Kommunikation zwischen den als
- 35 Feldgeräte ausgebildeten Einheiten und der Prozesssteuerung erfolgt nach dem Master-Slave-Prinzip; d. h. es gibt in der

Prozesssteuerung jeweils ein ausgezeichnetes Gerät, den Master, welcher den Feldbus betreibt, die ihm zugeordneten Slaves (Feldgeräte) parametriert und im zyklischen Betrieb den Datenaustausch durchführt. Bei dem Datenquerverkehr werden bestimmte Daten, hier die weiteren Signale, nicht über den Umweg über den Master, sondern unmittelbar zwischen den Slaves ausgetauscht, was zu einer Entlastung des Masters und einer Verkürzung der Zeit für die Datenübertragung führt. Der Buszyklus verlängert sich nicht wesentlich; eine Mischung von Master-Slave- und Querverkehrsbeziehungen ist beliebig möglich.

Alternativ oder ergänzend zu der Übertragung über den Feldbus kann in vorteilhafter Weise die Strahlungsquelle mit den weiteren Signalen moduliert werden, wobei die weiteren Signale in der weiteren Einheit durch Demodulation von den Messsignalen des Detektors getrennt werden. Die Modulation erfolgt dabei in einer solchen Weise, dass dadurch die selektive Absorption der Strahlung in dem Messgas nicht beeinträchtigt wird. So kann beispielsweise im Falle eines Diodenlaser-Spektrometers, bei dem eine Spektrallinie des Messgases zyklisch wellenlängenabhängig abgetastet wird, die Modulation mit den weiteren Signalen in einem außerhalb der Spektrallinie liegenden Bereich der Abtastung oder in den Lücken zwischen aufeinanderfolgenden Abtastzyklen erfolgen.

Bei einer weiteren Ausführung des erfindungsgemäßen Spektrometers können die Mittel zur Erzeugung des Messergebnisses aus den Messsignalen des Detektors in der die Strahlungsquelle enthaltenden Einheit angeordnet sein, wobei dann die Messsignale von der den Detektor enthaltenden weiteren Einheit über den Feldbus an die die Strahlungsquelle enthaltende Einheit übertragen werden.

Im Weiteren wird das erfindungsgemäße Spektrometer anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels erläutert.

Das hier als sehr vereinfachtes Blockschaltbild dargestellte Prozess-Absorptionsspektrometer besteht aus einer Einheit 1, die als Strahlungsquelle 2 einen durchstimbaren Diodenlaser aufweist, und einer Einheit 3, die einen photoelektrischen Detektor 4 enthält. Beide Einheiten 1 und 3 sind jeweils als Feldgeräte ausgebildet und über Kommunikationseinrichtungen 5 bzw. 6 an einem Feldbus 7 in einem Prozessautomatisierungssystem angeschlossen, von dem hier nur ein Mastergerät 8 dargestellt ist.

Die Einheit 1 des Spektrometers enthält weiterhin eine Steuereinrichtung 9, die eine Modulationseinrichtung 10 zur wellenlängenabhängigen Modulation der Strahlungsquelle 2 betreibt. Der von der Strahlungsquelle 2 ausgesandte Lichtstrahl 11 wird mittels eines Strahlteilers 12 teilweise über eine Glasfaser 13 auf einen Monitordetektor 14, über eine weitere Glasfaser 15 durch eine mit einem Referenzgas gefüllte Referenzgaszelle 16 auf einen Referenzdetektor 17 und aus der Einheit 1 heraus durch ein Messgas 18, beispielsweise in einem Rohr oder Kamin 19, hindurch zu dem Detektor 4 in der weiteren Einheit 3 geführt. Die von dem Detektor 4 erzeugten Messsignale werden in einer nachgeordneten Auswerteeinrichtung 20 zusammen mit weiteren Signalen zu einem Messergebnis ausgewertet, das zum einen auf einer Anzeige 21 der Einheit 3 visualisiert und zum anderen über die Kommunikationseinrichtung 6 in das Prozessautomatisierungssystem übertragen wird. Bei den erwähnten weiteren Signalen, die zur Erzeugung des Messergebnisses erforderlich sind, handelt es sich um die Referenzsignale des Referenzdetektors 17, die Monitorsignale des Monitordetektors 14 und um Informationen, die die Modulation der Strahlungsquelle 2 betreffen. Diese weiteren Signale werden in der Einheit 1 erzeugt und über die Steuereinrichtung 9 und die Kommunikationseinrichtung 5 auf den Feldbus 7 übertragen, um von der Kommunikationseinrichtung 6 der weiteren Einheit 3 empfangen und an die Auswerteeinrichtung 20 weitergeleitet zu werden. Die Kommunikation zwischen den beiden Einheiten 1 und 3 erfolgt dabei unmittelbar, d. h.

5

unter Umgehung des Masters 8, nach einem auch als Datenquer-
verkehr bezeichneten Slave-Slave-Übertragungsverfahren.

5 Ergänzend oder alternativ können die weiteren Signale auch
über den Lichtstrahl 11 unmittelbar zwischen den beiden Ein-
heiten 1 und 3 übertragen werden. Wie der Darstellung zu ent-
nehmen ist, wird die Strahlungsquelle 2 durch die Modulati-
onseinrichtung 10 mittels eines rampenförmig ansteigenden
10 Stromes I zyklisch angesteuert um eine Spektrallinie 22 des
Messgases 18 wellenlängenabhängig abzutasten. Die von der
Einheit 1 an die Einheit 3 zu übertragenden weiteren Signale
können dann in einem außerhalb der Spektrallinie 22 liegenden
Bereich 23 der Abtastung oder in Abtastlücken 24 zwischen
aufeinanderfolgenden Abtastungen aufmoduliert werden.

15

Alternativ zu dem dargestellten Ausführungsbeispiel können
die Auswerteeinrichtung 20 und die Anzeigevorrichtung 21 in
der die Strahlungsquelle 2 enthaltende Einheit 1 angeordnet
sein, wobei dann die Messsignale des Detektors 4 von der wei-
20 teren Einheit 3 über den Feldbus 7 an die die Strahlungsquel-
le 2 enthaltende Einheit 1 übertragen werden.

Die Stromversorgung der Einheiten 1 und 3 kann separat oder
ebenfalls über den Feldbus 7 erfolgen.

25

Patentansprüche

1. Prozess-Absorptionsspektrometer mit einer Strahlungsquelle (2) enthaltenden Einheit (1) und mindestens einer ei-
5 nen Detektor (4) enthaltenden weiteren Einheit (3), wobei beide Einheiten (1, 3) als Feldgeräte ausgebildet und an einem Feldbus (7) angeschlossen sind.
2. Prozess-Absorptionsspektrometer nach Anspruch 1, da -
10 d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die den Detektor (4) enthaltende weitere Einheit (3) Mittel (20) zur Erzeugung eines Messergebnisses aus Messsignalen des Detektors (4) und weiteren Signalen enthält, die von der die Strahlungsquelle (2) enthaltenden Einheit (1) an die den De-
15 tektor (4) enthaltende weitere Einheit (3) übertragen werden.
3. Prozess-Absorptionsspektrometer nach Anspruch 2, da -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die weiteren Signale zumindest teilweise über den Feldbus (7) übertragen
20 werden.
4. Prozess-Absorptionsspektrometer nach Anspruch 3, da -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die beiden Einheiten (1, 3) über den Feldbus (7) nach einem Slave-Slave-
25 Übertragungsverfahren miteinander kommunizieren.
5. Prozess-Absorptionsspektrometer nach einem der vorangehenden Ansprüche, da d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Strahlungsquelle (2) mit zumindest einem Teil der
30 weiteren Signale moduliert wird und dass in der weiteren Einheit (3) die weiteren Signale von den Messsignalen des Detektors (4) durch Demodulation getrennt werden.
6. Prozess-Absorptionsspektrometer nach Anspruch 1, da -
35 d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die die Strahlungsquelle (2) enthaltende Einheit (1) Mittel zur Erzeugung eines Messergebnisses aus Messsignalen des Detektors (4) ent-

7

hält und dass die Messsignale von der weiteren Einheit (3) über den Feldbus (7) an die die Strahlungsquelle (2) enthaltende Einheit (1) übertragen werden.

1/1

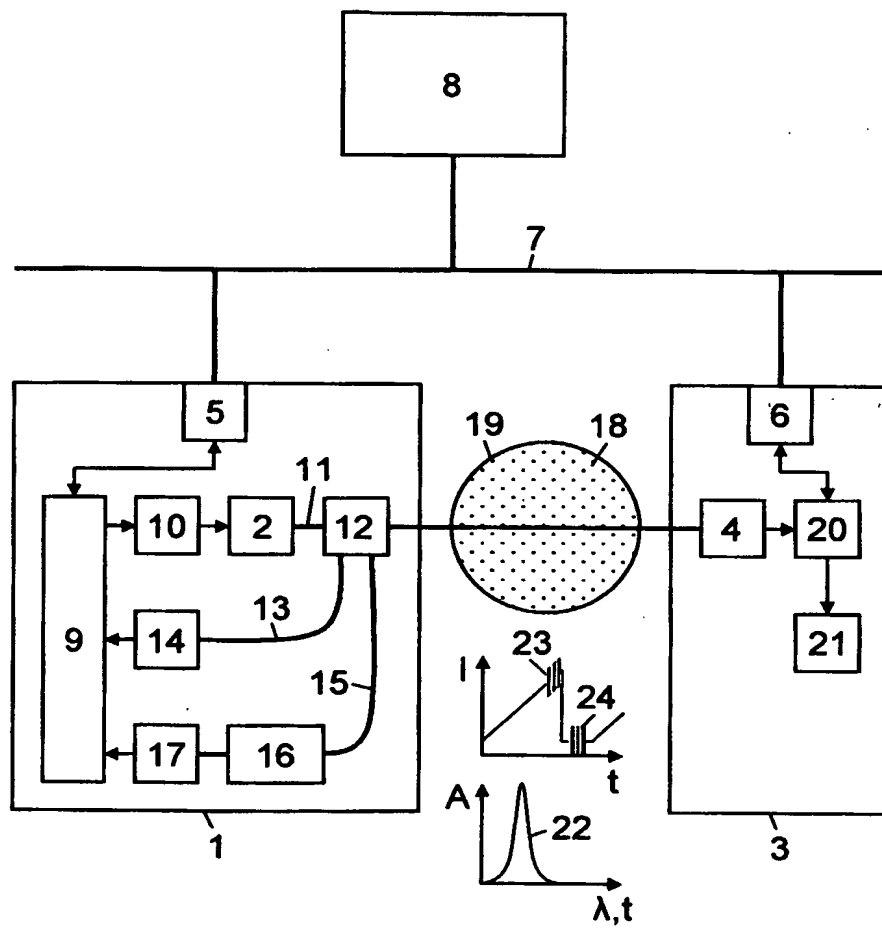


FIG. 1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Application No
PCT/EP2004/003473A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N21/31 G05B15/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G01N G05B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, Y	DE 101 58 745 A (SIEMENS AG) 26 June 2003 (2003-06-26) * Anspruch 1 *	1-4
Y	EP 0 290 274 A (HAMAMATSU PHOTONICS KK) 9 November 1988 (1988-11-09) * Zusammenfassung; Abbildung 4 *	1-4
Y	WO 02/095506 A (KASZKIN ANDREAS ; SIEMENS AG (DE); STIEHL WOLFGANG (DE)) 28 November 2002 (2002-11-28) * Seite 5, Zeile 32 - Seite 6, Zeile 16; Abbildung 1 *	1
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *8* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 July 2004

Date of mailing of the international search report

20/07/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hoogen, R

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In **nal Application No**
PCT/EP2004/003473**C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	TIAN G Y ET AL: "A Fieldbus-based intelligent sensor" MECHATRONICS, vol. 10, 2000, pages 835-849, XP004201716 * Abschnitt 2 * -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ional Application No
PCT/EP2004/003473

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 10158745	A	26-06-2003	DE	10158745 A1	26-06-2003
			WO	03049366 A2	12-06-2003
EP 0290274	A	09-11-1988	JP	63275327 A	14-11-1988
			JP	63277040 A	15-11-1988
			DE	3882273 D1	19-08-1993
			DE	3882273 T2	21-10-1993
			EP	0290274 A1	09-11-1988
			US	4907876 A	13-03-1990
WO 02095506	A	28-11-2002	DE	10124800 A1	12-12-2002
			WO	02095506 A2	28-11-2002
			EP	1390818 A2	25-02-2004

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ales Aktenzeichen

PCT/EP2004/003473

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
 IPK 7 G01N21/31 G05B15/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01N G05B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, COMPENDEX

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P, Y	DE 101 58 745 A (SIEMENS AG) 26. Juni 2003 (2003-06-26) * Anspruch 1 *	1-4
Y	EP 0 290 274 A (HAMAMATSU PHOTONICS KK) 9. November 1988 (1988-11-09) * Zusammenfassung; Abbildung 4 *	1-4
Y	WO 02/095506 A (KASZKIN ANDREAS ; SIEMENS AG (DE); STIEHL WOLFGANG (DE)) 28. November 2002 (2002-11-28) * Seite 5, Zeile 32 - Seite 6, Zeile 16; Abbildung 1 *	1



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

12. Juli 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

20/07/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hoogen, R

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>TIAN G Y ET AL: "A Fieldbus-based intelligent sensor"</p> <p>MECHATRONICS,</p> <p>Bd. 10, 2000, Seiten 835-849, XP004201716</p> <p>* Abschnitt 2 *</p> <p>-----</p>	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In ☐ ales Aktenzeichen

PCT/EP2004/003473

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 10158745	A	26-06-2003	DE	10158745 A1	26-06-2003
			WO	03049366 A2	12-06-2003
EP 0290274	A	09-11-1988	JP	63275327 A	14-11-1988
			JP	63277040 A	15-11-1988
			DE	3882273 D1	19-08-1993
			DE	3882273 T2	21-10-1993
			EP	0290274 A1	09-11-1988
			US	4907876 A	13-03-1990
WO 02095506	A	28-11-2002	DE	10124800 A1	12-12-2002
			WO	02095506 A2	28-11-2002
			EP	1390818 A2	25-02-2004